

2025年度製造工程検査部門シンポジウム

主催：(一社)日本非破壊検査協会 製造工程検査部門

日時：2026年3月26日（木）12:30～16:30
2026年3月27日（金）10:00～14:45

会場：愛知工業大学 本山キャンパス3階304室
〒464-0807 名古屋市千種区東山通1-38-1

開催形式：完全対面

参加費：	JSNDI 正会員		¥4,000	
	登壇者			
	学生会員			
	非会員	一般		
	学生			

懇親会：2026年3月26日（木）17:00～19:00 予定

【会費】：(一般) 5,000 円、(学生) 3,000 円

【会場】：未定

申込方法 部門ホームページの[参加申込]からお申し込み下さい。
(<https://sciences.jsndi.jp/manu/studygroup/symposium/>)
*参加申込みの締め切り日：2026年3月18日(水)

問合先：(一社)日本非破壊検査協会
2025年度製造工程検査部門シンポジウム係
TEL:03-5609-4015
E-mail: beppu@jsndi.or.jp

プログラム

※注：講演時間は25分（講演20分、質疑5分）となります。

第1日目 3月26日（木）12:30～16:30

開会挨拶 (12:30-12:40)
製造工程検査部門主査 浮田浩行（徳島大学）

休憩 (15:20～15:30)

特別講演

(15:30～16:30)

座長 浮田浩行（徳島大学）

「JSNDIは（検査画像の宝庫だから）DL時代の寵児に」
(同) YYC ソリューション ○輿水大和

◆懇親会（17:00～19:00、会場近辺を予定）

第2日目 3月27日（金）10:00～14:45

3. 画像を用いた外観検査・非破壊検査(2) (10:00-11:40)

座長 塚田敏彦（愛知工業大学）

3-1 誤判定傾向の学習に基づく検査結果の精緻化のための Anomaly-Map Refiner の提案
中京大学 ○村上尚生、平松直人、小林大起
秋月秀一、橋本 学

3-2 少数データによる SAM のファインチューニングと自動セグメンテーションの実現
富士電機(株) ○矢崎敬祐

3-3 構成要素の論理的整合性評価による Juice bottle の異常検知
中京大学 ○小原那南斗、村上尚生、平松直人
小林大起、秋月秀一、橋本 学

3-4 良品画素群の時空間分布特性のモデル化に基づく欠陥セグメンテーション
中京大学 ○小平翔吾、袴田紘基
尾野裕一朗、青木公也

(同)YYC ソリューション/中京大学 輿水大和
セイコーエフューチャクリエーション(株)
伊藤麻里、高橋正美

昼休み (11:40～13:00)

4. 画像データセット、画像を用いた制御 (13:00-14:40)

座長 浮田浩行（徳島大学）

4-1 半導体パターン画像を対象とした人工画像による SAM2 の ファインチューニング
東京エレクトロン(株) ○近藤泰成、中村隆央
狐塚正樹、茂木弘典

4-2 外観検査自動化に向けた不良品合成データ生成技術
(株)IHI ○水山佳乃

4-3 ImageNet のクラス構造再設計に基づく欠陥に敏感な特徴抽出器のための事前学習
中京大学 ○大田直輝、村上尚生、平松直人
小林大起、秋月秀一、橋本 学

4-4 カメラ画像を用いた休耕田草刈りロボットの移動制御
愛知工業大学 ○太田拓海、沢尾一真、塚田敏彦
しきしまの家 鈴木辰吉
豊田市 安藤 真

閉会挨拶 (14:40～14:45)
製造工程検査部門主査 浮田浩行（徳島大学）

2. 機械学習を用いた検査手法 (14:05-15:20)

座長 青木公也（中京大学）

2-1 回路基板検査における生成的異常検知: CAD 設計情報による正常特徴復元
日東電工(株) ○平本亮介、生川朝美、木川洋一
2-2 CT 画像を用いた骨粗しょう症診断支援システムの開発
—Neural Network Console を用いた 2段階学習—
明石工業高等専門学校 ○平野雅嗣、手塚凜音、宮田時匠
大阪電気通信大学 光本浩士
2-3 対象物の空間的近接構造を利用した軽量クラスタ推定に基づく PatchCore の高速化
中京大学 ○平松直人、村上尚生、小林大起
秋月秀一、橋本 学

休憩 (13:55～14:05)

- すべての講演において、発表資料の撮影（録画）、録音、保存、印刷等の行為は禁止します。
- 座長の状況判断により発表順番の入れ替え等を行う可能性がある事をご了解ください。
- 座長及び講演日時は、変更される場合があります。